

JPCA Show 2015 参展通知（日本电产理德）

2015 年 5 月 27 日

我司将于 2015 年 6 月 3 日（星期三）至 5 日（星期五），参加在东京国际会展中心举办的「JPCA Show 2015」。届时，我司主要展出半导体封装检测装置「GATS-6310」及柔性电路板通电检测装置「NRFEIS-3045A」，同时推出光学检测技术及车载检测装置等，可为您提供多领域、广范围的检测方案。此外，还将展出性能更高的新一代测试仪、高精度的检测治具。敬请拨冗莅临。

【主要展示内容】

- 半导体封装检测装置「GATS-6310」
- 印刷电路板检测装置「STARREC M6IIW/SW」
- 高速/高精度测试仪「R-6510is」
- 光学式外观检测装置「RSH-S230T」、「RWi-300」
- 高精度检测用治具 同轴 MEMS、15 um 探针治具、通用治具
- 柔性电路板检测装置「NRFEIS-3045A」
- 车载数据记录器「Trend Coder」及其他相关产品

我们期待您的光临。

会場： 东京国际会展中心 東 5 会场

会期： 2015 年 6 月 3 日(星期三)~5 日(星期五)

展示位： 5C-04

公式 H P： <http://www.jpcashow.com/show2015/ch/>